Локатор короткого замыкания
3 диапазона сопротивления. Аудиоиндикация дальности от замыкания. Автоматическая калибровка пробника. Визуальная индикация дальности до замыкания. Звуковая индикация неразрывности цепи.

Тестер микросхем
64 тестовых канала (расширяемо до 256). 4 выхода отключения шин. Тестирование на соответствие таблице истинности, напряжения, соединений, термальных характеристик и аналоговых сигнатур. Внутрисхемное и внесхемное (с адаптером) тестирование. Библиотеки ТТЛ, КМОП, памяти, интерфейсных микросхем, БИС, ЦПУ, ПМЛ, линейных микросхем и корпусов.
Программируемые пороги срабатывания. Режимы циклического тестирования для обнаружения редких отказов. Менеджер пользовательской библиотеки для добавления новых или специализированных микросхем. Режим для отображения формы тестовых сигналов.

Источник питания
5 В DC до 5А для питания тестируемой платы. Защита от перенапряжения и ограничение по току. Электронно контролируемый. Программируемая задержка выключения.

Тестер цифровых сигнатур
Оптимизирован для цифровых компонентов. 64 тестовых канала (расширяемо до 256). Напряжение от 2.5 до 20В. Возможность масштабирования графика. Ток ограничен для защиты микросхемы.

Графический тестовый генератор
64 канала (расширяемо до 256). Графически программируется для пользовательских тестовых векторов. Векторы могут сохраняться и загружаться или сохраняться в качестве эталона.

Идентификатор микросхемы
Идентификация неизвестной, нечитаемой или специализированной микросхемы.

Верификация памяти EPROM
Чтение, просмотр, соханение и верификация EPROM объемом от 2k x 8 до 256k x 8. Внутри- и внесхемно (с адаптером).

Модуль Board Fault Locator требует наличия ПК. Модули доступны с интерфейсом PCI или USB и программным обеспечением SYSTEM 8 Ultimate.

Цифровые компоненты

Внесхемно

Внутрисхемно

Требуется ПК

Внутри- и внесхемное тестирование
Сквозной монтаж или SMT
От вентилей NAND до CPU
DIL, PLCC или SOIC
Стандартные и настраиваемые уровни
ТТЛ иои КМОП

Модуль SYSTEM 8 Board Fault Locator (BFL)

Функциональный тестер микросхем, предоставляющий множество методов тестирования для повышения уровня покрытия неисправностей: внутрисхемное тестирование микросхем, анализ внешний соединений выводов, уровня напряжения на них, а также их аналоговых сигнатур.

abi

www.abielectronics.co.uk

64- канальный модуль Board Fault Locator

Возможности тестирования микросхем

Количество каналов I/O: 64-256
Количество выходов заземления: 4 или 8

Сравнение в реал. времени: 64 x 2, 128 x 2 с доп.модулями
Выходное напряжение: совместимо с ТТЛ/КМОП
Выходной ток: Зависит от устройства
Тип. H-L 80мА @ 0.6В
Тип. L-H 200мА @ 2В
Макс. 400мА
Скорость нарастания >100В/мкс
Напряжение входа: +/-10В
Входной импеданс: 10 кОм
Нагрузка: Программируемая: z-состояние/ОК
Состояние: Низкий, высокий, z-состояние
Защита от перенапряжения: <0.5В, >5.5В
Время тестирования: Зависит от устройства
Тип схемы: Внутрисхемно, внесхемно (с адаптером)

Источник питания для тестируемой платы

Автоматический источник питания: 1 x 5В @ 5А,фиксированный
(2 x 5В @ 5А фиксированный
для 128 каналов) Защита от перенапряжения: 7 В
Ток короткого замыкания: 7А

Типы тестов

Одиночный: Одиночный тест
Цикл: Бесконечный, цикл пока
Авто: "годен", цикл пока "не годен"
Определение порог срабатывания

Тестовые пороги

Разрешение: 100 мВ
Низкий уровень: ТТЛ от 0.1В до 1.1 В
КМОП от 0.1 В до 1.5В
Уровень переключения: ТТЛ от 1.0В до 2.3 В
КМОП от 1.0 В до 3.0 В
Высокий уровень: ТТЛ от 1.9В до 4.9В
КМОП от 1.9В до 4.9В
Низкий уровень (свип.): ТТЛ от 0.1В до 1.1В
КМОП от 0.1В до 1.5 В
Уровень переключения (свип): ТТЛ 1.2В
КМОП 2.5В
Высокий уровень (свип.): ТТЛ от 1.9В до 4.9В
КМОП от 1.9В до 4.9В

Типы тестов

Таблица истинности (функциональный): функциональный, с предустановленными библиотеками компонентов

Соедининия (MDA): Детектирование замыкания
Детектирование "плавающего" входа
Детектирования неподключенного входа
Детектирование связей между выводами
Напряжение: Разрешение 10мВ
Диапазон +/-10В
Детектирование логического состояния
Сигнатуры: Количество каналов 64 - 256
Диапазон свипирования от -10В до +10V (программируемый)
Максимальный тестовый ток 1мА
Несколько графиков с единым масштабированием
Температурный: Индикация температуры вывода

Тестовые библиотеки

Классы библиотек: ТТЛ 54/74, КМОП, память, интерфейсные, БИС, микропроцессоры, микросхемы PAL/EPLD, линейные, корпуса, специализированные и пользовательские DIL, SOIC, PLCC, QFP
Типы корпусов:

Комплект поставки

Стандартно
Автоматический адаптер для внесхемного тестирования
1 x 64-канальный тестовый кабель
1 x 64 разделенный тестовый кабель
1 x сборка для анализа сигнатур
1 x кабель BDO
1 x пробник для локализации КЗ
1 x зажим заземления
1 x сборка PSU

Опции

Внутренние Интерфейс PCI
Внешние Корпус MultiLink (платная опция) с шиной USB.
Внешний корпус (платная опция), включающий до 5-ти модулей SYSTEM 8 (интерфейс USB).

Компания ABI продолжает совершенствовать свою продукцию для повышения качества. Таким образом, реальные характеристики модулей могут отличаться от описанных в этом документе.

ООО "ЭлекТрейд-М" - официальный партнер ABI Electronics
Тел./Факс: +7 (495) 800-2360
E-mail: info@eltm.ru
www.eltm.ru